18p-C14-8

# 銀ナノ微粒子にコートされた CdS の複素三次非線形感受率スペクトル

The complex third-order nonlinear susceptibility spectrum

of CdS coated to a silver nanoparticle

# 徳島大院 〇岡本 敏弘, 原口 雅宣

Univ. of Tokushima, <sup>°</sup>Toshihiro Okamoto and Masanobu Haraguchi E-mail: toshi-okamoto@tokushima-u.ac.jp

# <u>背景・目的</u>

数 10nm サイズの金属微粒子の周りに CdS のような光カー媒質を配置し、局在表面プラズ モン(Localized Surface Plasmon: LSP)の増強近 接場光でその屈折率を変化させれば,1個のナ ノ微粒子だけで全光型光変調や光スイッチン グができると考えられる。一方,その非線形光 学現象を詳しく調べることで、微量なナノ材料 の3次非線形感受率(3)の高感度計測も可能に なると期待される。これまで我々は CdS がコ ートされた Ag 微粒子に着目し, 顕微分光法を 用いて, 単一の CdS コート Ag ナノ微粒子にお ける散乱光強度の非線形応答の観測に成功し た。[1] 今回, 光カー効果を考慮した Mie 理論 計算シミュレーションと参考文献[1]の実験結 果を比較することで、CdS コート膜の複素 3 次非線形感受率 χ<sup>(3)</sup>Cds スペクトルを求めるこ とができたので報告する。

#### <u>解析方法・結果</u>

光カー効果を考慮した Mie 理論計算[2,3]に おいて、均質なコアシェル構造を想定し、CdS の比誘電率 $\mathcal{E}_{CdS}$ を次のように仮定した。

 $\varepsilon_{CdS}(\left|E_{R}(r)\right|^{2}) = \varepsilon_{l} + \frac{3}{4}\chi_{CdS}^{(3)}\left|E_{R}(r)\right|^{2}$ 

ここで, *<sub>G</sub>*は CdS の線形比誘電率, *E<sub>R</sub>(r)*は位置 *r*における局所電界(半径方向成分)である。

個々の CdS コート Ag ナノ微粒子について, 実験で得られた規格化散乱光強度と, Mie 理論 計算で求めた CdS 表面の近接場光強度のそれ ぞれの入射光強度依存性がフィットするよう に複素χ<sup>(3)</sup>cds を求めた。その結果を Fig.1 に示 す。図中の青三角, 緑丸, 赤四角はそれぞれ線 形散乱光スペクトルの異なる微粒子 A, B, C (Table 1 参照) による結果である。粒子が異



Fig.1 The complex  $\chi^{(3)}$  spectra of CdS coated to a silver nanoparticle

Particle	Diameter of particle $2(a+d)$ (nm)	Radius of Ag $a$ (nm)	Thickness of CdS d (nm)	LSP energy $\hbar\omega_{LSP}(eV)$
$A( \bigtriangleup \bigtriangleup)$	29	9.3	5.2	2.49
B (●○)	36	10.0	8.0	2.40
C (	42	8.0	13.0	2.29

なっても、ほぼ同一の $\chi^{(3)}_{cds}$ スペクトルを示す ことが確認された。Ag 微粒子にコートした CdS の複素 $\chi^{(3)}_{cds}$ は、実部・虚部共に、CdS の バンド間遷移が生じる $\hbar\omega$  > 2.4eV で大きくな り、虚部が極大になった $\hbar\omega$ =2.43eV で、 $\chi^{(3)}_{cds}$   $\simeq$ (1.1+*i*0.6)×10<sup>-17</sup> m<sup>2</sup>/V<sup>2</sup> となることがわかった。 本実験の結果が結晶 CdS の $\chi^{(3)}$  値(4.8×10<sup>-17</sup> m<sup>2</sup>/V<sup>2</sup> @2.41eV [4])よりも小さくなったのは、 逆ミセル法で作られた CdS が不完全な結晶で あったことが原因だと考えられる。

# **References**

- [1] T. Okamoto et al., APEX 1, 062003 (2008)
- [2] T. Okamoto et al., J. Microsc., 210, 193(2003)
- [3] T. Okamoto et al., JJAP **43**, 6507 (2004)
- [4] Z. Li et al., J. Cryst. Growth 138, 231 (1994)